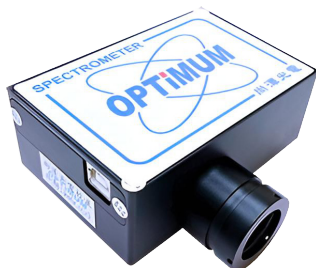
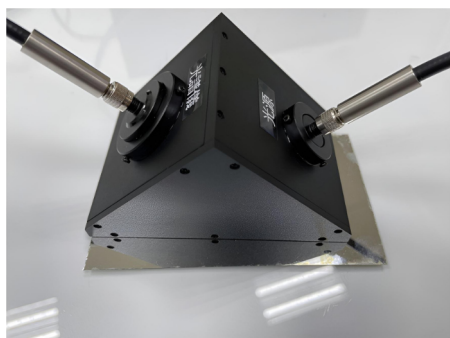
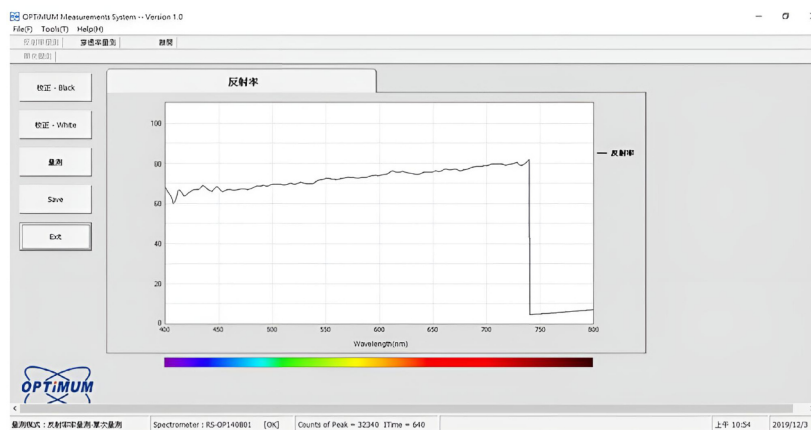


OOC-SM-2000 ミラー型反射率測定システム

OOC-SM-2000 ミラー型反射率測定システムは、分光反射率（45°/45°）測定に対応し、研究開発から品質管理まで幅広い用途で高信頼性の反射率測定を提供します。420-850 nmの広範囲にわたる波長をカバーし、安定した測定結果を保証します。0.5nmの分光分解能と1nmの波長繰返し精度により、微細な分光情報も正確に捉えます。



モデルタイプ	OOC-SM-2000 ミラー型反射率測定システム
機能	反射率測定
検出器	ソニー製CCDアレイ
波長範囲	420～850 nm
測光精度	± 0.5% @555 nm
測光再現性	± 1% (400～800 nm)、他の波長は±2%
スペクトル分解能	0.5 nm
波長再現性	1 nm
光源	ハロゲン光源
スポット径	> 5 mm
測定時間	0.5～10 秒
測定項目	反射率応答曲線(サンプル反射スペクトル)の表示、各波長の反射率表示、全波長での各波長のデータ表示、測定データ保存
対応OS	Windows 7 ～ 11 / USB 2.0



反射率応答曲線、各波長の反射率、全波長における各ポイントのデータ表示、および測定データの保存機能を備え、データの解析と管理を効率化します。OOC-SM-2000ミラー型反射率測定システムは、その堅牢な設計と高機能な測定能力により、塗料、繊維、プラスチック、食品、農業など、反射率の精密な評価が求められるあらゆる分野に最適なソリューションです。